

УДК 621.535

## ВЛИЯНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ СРЕДЫ НА ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ОТРАЖЕНИИ СВЕТА

А. А. Голубков, В. А. Макаров

(кафедра общей физики и волновых процессов)

Показано, что вопреки мнению ряда авторов наблюдавшиеся в последнее время поляризационные эффекты при взаимодействии света малой интенсивности с кристаллами класса  $\bar{4}3m$  (GaAs, InSb) не являются свидетельством нарушения принципа симметрии кинетических коэффициентов в этих кристаллах, так как обусловлены главным образом приповерхностной неоднородностью их оптических свойств. Указаны поляризационные эффекты, обнаружение которых действительно подтвердило бы нарушение принципа симметрии кинетических коэффициентов в этих кристаллах.

В последнее время было опубликовано несколько интересных экспериментальных работ [1–3], в которых сообщается о наблюдении поляризационных эффектов при нормальном отражении света малой интенсивности от поверхности [001] кристаллов класса  $\bar{4}3m$  (GaAs, InSb), а также при прохождении света вдоль оптической оси таких кристаллов. При этом утверждается, что наблюдаемые эффекты обусловлены отличием от нуля симметричной (по перестановке первых двух индексов) части тензора  $\gamma_{ijk}$ , описывающего нелокальность опти-

ческого отклика среды в подходе Ландау–Лифшица:

$$D_i = \varepsilon_{ij} E_j + 4\pi \gamma_{ijk} \nabla_k E_j, \quad (1)$$

и делается вывод, что в указанных кристаллах имеет место нарушение принципа симметрии кинетических коэффициентов, свидетельствующее о наличии в них слабых магнитных структур (антисимметричная по перестановке первых двух индексов часть  $\gamma_{ijk}$  в кристаллах класса  $\bar{4}3m$  всегда равна нулю по причине симметрии). Такое объяснение наблюдавшихся в работах [1–3]

эффектов уже подвергалось критике [4]. Однако эта критика носила исключительно качественный характер.

Целью настоящего сообщения является количественный анализ отмеченных эффектов, показывающий, что из экспериментальных результатов работ [1–3] на самом деле следуют выводы, противоположные тем, которые сделаны их авторами. В данной работе также выявлено принципиально новое направление экспериментального поиска проявлений возможного неравенства нулю симметричной части тензора пространственной дисперсии  $\gamma_{ijk}$ .

Предположим, что в образцах, исследованных в работах [1–3], в силу каких-то причин симметричная (по перестановке первых двух индексов) часть тензора  $\gamma_{ijk}$  действительно не равна нулю, и рассмотрим нормальное падение света на поверхность кристалла класса  $\bar{4}3m$ , перпендикулярную его кристаллофизической оси [001] (ось  $X_3$ ). При отсутствии поверхностных дефектов эта поверхность имеет три элемента симметрии: поворотную ось симметрии второго порядка ( $2X_3$ ) и две взаимно перпендикулярные плоскости симметрии ( $m_{X_1X_2}, m_{-X_1X_2}$ ) [5]. Иными словами, класс симметрии поверхности —  $mm2$ , но ее кристаллофизические оси  $x$  и  $y$  повернуты на  $45^\circ$  относительно кристаллофизических осей  $X_1$  и  $X_2$  самого кристалла. В дальнейшем мы будем в основном проводить вычисления в системе координат  $x, y, z$  ( $z = X_3$ ). В этой системе материальные тензоры, характеризующие линейный оптический отклик рассматриваемых сред, имеют вид

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ij} &= \varepsilon_1 \delta_{ij}; & \gamma_{113} &= \gamma_{131} = \gamma_{311} = \gamma_0, \\ \gamma_{223} &= \gamma_{232} = \gamma_{322} &= -\gamma_0, \end{aligned} \quad (2)$$

остальные  $\gamma_{ijk} = 0$ . Здесь  $i, j, k = 1, 2, 3$ ;  $\delta_{ij}$  — символ Кронекера, а индексы 1, 2 и 3 соответствуют осям  $x, y$  и  $z$ .

Простая подстановка в волновое уравнение

$$k^2 \mathbf{E} - \mathbf{k}(\mathbf{kE}) = \frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{D} \quad (3)$$

дает возможность легко убедиться, что в первом приближении по параметру пространственной дисперсии  $\mu = \omega|\gamma_0|/c$  волны  $\mathbf{E}^{(+)}(z, t)$  и  $\mathbf{E}^{(-)}(z, t)$ , распространяющиеся соответственно в положительном и отрицательном направлениях оси  $z$ , могут быть представлены в виде

$$\mathbf{E}^{(+)}(z, t) = (E_{1x} e^{-\rho_0 z} \mathbf{e}_x + E_{1y} e^{\rho_0 z} \mathbf{e}_y) \exp(ik_1 z - i\omega t), \quad (4)$$

$$\mathbf{E}^{(-)}(z, t) = (E_{2x} e^{-\rho_0 z} \mathbf{e}_x + E_{2y} e^{\rho_0 z} \mathbf{e}_y) \exp(-ik_1 z - i\omega t), \quad (4)$$

где  $\rho_0 = 2\pi\gamma_0\omega^2/c^2$ ,  $k_1^2 = \omega^2\varepsilon_1/c^2$ ,  $\mathbf{e}_x$  и  $\mathbf{e}_y$  — единичные орты осей  $x$  и  $y$  соответственно,  $\omega$  — частота падающего света.

Для нахождения характеристик отраженного и прошедшего света воспользуемся уточненными граничными условиями, позволяющими в модели резкой границы

учитывать влияние реально существующей приповерхностной неоднородности среды [6, 7]. В случае нормального падения света их можно представить в виде

$$E_{x,y}^{(2)} = E_{x,y}^{(1)}, \quad [\mathbf{n}, \mathbf{B}^{(2)} - \mathbf{B}^{(1)}] = \frac{4\pi\hat{\eta}}{c} \frac{\partial \mathbf{S}}{\partial t}, \quad (5)$$

где  $\mathbf{n}$  — вектор единичной нормали, направленный из среды 1 в среду 2,  $\mathbf{B}$  — индукция магнитного поля волны,  $\mathbf{B}^{(m)}$ ,  $\mathbf{E}^{(m)}$  — значения полей в среде  $m$  ( $m = 1, 2$ ) вблизи границы,  $\mathbf{S} = \mathbf{E} + (\mathbf{D} - \mathbf{E}, \mathbf{n})\mathbf{n}$ , а  $\hat{\eta}$  характеризует диэлектрические свойства отражающей поверхности. С учетом симметрии последней тензор  $\hat{\eta}$  имеет диагональный вид [5] независимо от его внутренней симметрии.

Эксперименты [1–3] проводились при почти нормальном падении света (отклонения составляли  $\sim 1^\circ$ ). При расчетах это позволяет, с одной стороны, считать падение света строго нормальным, а с другой — пренебречь эффектами, связанными с многократными отражениями от противоположных граней кристалла. В этом приближении, пользуясь (4) и (5), можно показать, что  $\mathbf{E}^{(r)}$ ,  $\mathbf{E}$  и  $\mathbf{E}_2^{(r)}$  — соответственно амплитуды отраженной, однократно прошедшей среду и дважды прошедшей среду (туда и обратно после отражения от расположенного за кристаллом зеркала) волн следующим образом связаны с амплитудой падающей волны  $\mathbf{E}^{(i)}$ :

$$\begin{aligned} E_{x,y}^{(r)} &= (-R + r_{x,y}^{(1)} T_0) E_{x,y}^{(i)}, \\ E_{x,y} &= T_0 T_1 (1 + r_{x,y}^{(1)}) (1 + r_{x,y}^{(2)}) \exp(\mp \rho_0 L) E_{x,y}^{(i)}, \quad (6) \\ E_{2x,2y}^{(r)} &= -T_0^2 T_1^2 (1 + r_{x,y}^{(1)})^2 (1 + r_{x,y}^{(2)})^2 E_{x,y}^{(i)}, \end{aligned}$$

где  $L$  — длина среды,  $R = (k_1 - k_0)/(k_1 + k_0)$ ,  $T_0 = 2k_0/(k_1 + k_0)$ ,  $T_1 = 2k_1/(k_1 + k_0)$ ,  $k_0 = \omega/c$ ,  $r_{x,y}^{(m)} = i\Delta_{x,y}^{(m)}/(k_1 + k_0)$ ,  $\Delta_{x,y}^{(m)} = \Delta_{1,2}^{(m)} \pm (-1)^m \rho_0$ ,  $\Delta_{1,2}^{(m)} = 4\pi\omega^2 \eta_{1,2}^{(m)}/c^2$ ,  $\eta_1^{(m)} = \eta_{11}^{(m)}$ ,  $\eta_2^{(m)} = \eta_{22}^{(m)}$ ,  $m = 1, 2$ ,  $\hat{\eta}^{(1)}$  и  $\hat{\eta}^{(2)}$  характеризуют диэлектрические свойства передней и задней поверхностей соответственно. Соотношения (6) получены в первом приближении по параметрам  $\mu$  и  $\mu_1$ , где  $\mu_1 \propto |\hat{\eta}|/k_1$  характеризует влияние приповерхностной неоднородности кристалла на отражение и преломление света. В этом же приближении и в предположении  $\rho_0 L \ll 1$  (последнее следует из малости эффектов, наблюдавшихся в работе [2]) из (6) нетрудно получить, что в случае падения на кристалл линейно поляризованного света поворот его плоскости поляризации в рассматриваемых трех случаях определяется следующими соотношениями:

$$\Delta\beta_r = \text{Im} \left\{ \frac{k_0 (\Delta_2^{(1)} - \Delta_1^{(1)} + 2\rho_0)}{k_1^2 - k_0^2} \right\} \cos(2\beta_0), \quad (7.1)$$

при однократном прохождении света через кристалл

$$\Delta\beta_t = (\text{Re}\{\rho_0 L\} + \text{Im}\{\Delta_s\}) \cos(2\beta_0), \quad (7.2)$$

при прохождении света через кристалл и обратно

$$\Delta\beta_{2r} = 2 \operatorname{Im}\{\Delta_s\} \cos(2\beta_0). \quad (7.3)$$

В (7)  $\Delta_s = (\Delta_1^{(1)} - \Delta_2^{(1)} + \Delta_1^{(2)} - \Delta_2^{(2)}) / [2(k_1 + k_0)]$ ,  $\beta_0$  — угол поворота плоскости поляризации падающего света относительно кристаллофизической оси  $X_1$  ([100]) кристалла (а не оси  $x$ , повернутой относительно оси  $X_1$  на  $45^\circ$ ). Для сравнения воспроизведем (в наших обозначениях) формулы для  $\Delta\beta_r$  и  $\Delta\beta_t$ , приведенные в работе [2] (формула для  $\Delta\beta_{2r}$  в [2] отсутствует):

$$\tilde{\Delta}\beta_r = \operatorname{Im}\left\{\frac{4k_0\rho_0}{k_1^2 - k_0^2}\right\} \cos(2\beta_0), \quad (8.1)$$

$$\tilde{\Delta}\beta_t = \operatorname{Re}\{\rho_0 L\} \cos(2\beta_0). \quad (8.2)$$

Нетрудно видеть, что (8.1) можно получить из (7.1), если предположить, что

$$\Delta_2^{(1)} - \Delta_1^{(1)} = 2\rho_0. \quad (9)$$

Вместе с тем следует иметь в виду, что выражение (8.1) было получено в [8] исходя из граничных условий, предложенных в статье [9]. Последние же, как показано в [6], являются некорректными, так как могут приводить к результатам, противоречащим закону сохранения энергии.

Что касается соотношения (8.2), то оно получается из (7.2) в предположении слабого влияния приповерхностной неоднородности на отражение и преломление света:

$$\operatorname{Im}\{\Delta_s\} \ll \operatorname{Re}\{\rho_0\} L. \quad (10)$$

Однако приведенные в [2] результаты измерений  $\Delta\beta_{2r}$  и  $\Delta\beta_t$  показывают, что  $\Delta\beta_{2r} \approx 2\Delta\beta_t$ . Последнее в силу (7.2) и (7.3) означает, что основной вклад в изменение поляризационных характеристик однократно и дважды прошедшего среду света вносит анизотропия приповерхностного слоя. А следовательно, предположение (10), сделанное в [2], необоснованно. Таким образом, соотношения (8) не могут использоваться для интерпретации наблюдаемых в работах [1–3] эффектов.

Посмотрим теперь на результаты [1–3], имея в виду соотношения (7). Из (7) следует, что  $\Delta\beta_{2r} = 2\Delta\beta_t$ , если только  $\operatorname{Re}\{\rho_0\} = 0$ . Следовательно, основной интерес в работе [2] (вопреки мнению авторов) представляет наблюдавшееся там небольшое отличие  $\Delta\beta_{2r}$  от  $2\Delta\beta_t$ , поскольку именно оно может означать, что  $\operatorname{Re}\{\rho_0\} \neq 0$ . Следует, однако, иметь в виду, что это отличие может быть вызвано и другими причинами, например эффектами второго порядка малости по  $\mu$  и (или)  $\mu_1$ . К сожалению, из текста работы [2] не ясно, может ли точность описанного там эксперимента гарантировать,

что  $\Delta\beta_{2r}$  действительно не равно  $2\Delta\beta_t$ . Однако в любом случае из экспериментов [2] вытекает, что

$$\operatorname{Re}\{\rho_0\} L \ll \operatorname{Im}\{\Delta_s\}. \quad (11)$$

Таким образом, с учетом (11) из (7) непосредственно следует, что все наблюдавшиеся в работах [1–3] линейные эффекты обусловлены (по крайней мере в основном) неоднородностью диэлектрических свойств кристалла вблизи поверхности и прежде всего отличием симметрии приповерхностного слоя от симметрии толщи среды.

В [2] наблюдалось также некоторое отличие зависимости  $\Delta\beta_{2r}(\beta_0)$  от предсказываемой (7.3):

$$\Delta\beta_{2r}^{(\text{exp})} = A \cos[2(\beta_0) + \Delta\beta], \quad (12)$$

где  $\Delta\beta = 24^\circ$ . Учитывая, что для света, отраженного от передней грани кристалла, подобных расхождений не наблюдалось, можно предположить, что отличие (12) от (7.3) обусловлено небольшими дефектами кристаллической решетки в толще кристалла. Вместе с тем приведенных в работе [2] результатов недостаточно для полного исключения возможного влияния на возникновение  $\Delta\beta$  других причин, например дефектов задней грани кристалла, изменяющих ее симметрию.

Таким образом, экспериментальные результаты, представленные в [2], вопреки мнению авторов, указывают на выполнение (в пределах точности эксперимента) принципа симметрии кинетических коэффициентов в GaAs.

Авторы благодарны Н. И. Коротею за полезные обсуждения, а также Российскому фонду фундаментальных исследований за частичную финансовую поддержку настоящей работы (грант 95-02-05166-а).

#### Литература

1. Bungay A.R., Kugler N., Zheludev N.I. // Phys. Lett. 1993. **A174**. P. 335.
2. Bungay A.R., Popov S.V., Svirko Yu.P. et al. // Chem. Phys. Lett. 1994. **217**. P. 249.
3. Zheludev N.I., Popov S.V., Svirko Yu.P. et al. // Phys. Rev. 1994. **B50**. P. 11508.
4. Lew Yan Voon L.C., Fainstein A., Etchegoin P. et al. // Phys. Rev. 1995. **B52**. P. 2201.
5. Сиротин Ю.И., Шаскольская М.И. Основы кристаллофизики. М., 1975.
6. Голубков А.А., Макаров В.А. // УФН. 1995. **165**. С. 339.
7. Голубков А.А., Макаров В.А. // Изв. РАН, сер. физ. 1995. **59**, №12. С. 93.
8. Bungay A.R., Svirko Yu.P., Zheludev N.I. // Phys. Rev. 1993. **B47**. P. 16141.
9. Bungay A.R., Svirko Yu.P., Zheludev N.I. // Ibid. P. 11730.

Поступила в редакцию  
30.05.97